

(12) International Application Status Report

Received at International Bureau: 21 January 2019 (21.01.2019)

Information valid as of: 10 May 2020 (10.05.2020)

Report generated on: 18 September 2020 (18.09.2020)

(10) Publication number:

WO2020/113726

(43) Publication date:

11 June 2020 (11.06.2020)

(26) Publication language:

Chinese (ZH)

(21) Application Number:

PCT/CN2018/124285

(22) Filing Date:

27 December 2018 (27.12.2018)

(25) Filing language:

Chinese (ZH)

(31) Priority number(s):

201811479374.0 (CN)

(31) Priority date(s):

05 December 2018 (05.12.2018)

(31) Priority status:

Priority document received (in compliance with PCT Rule 17.1)

(51) International Patent Classification:

G01N 21/65 (2006.01)

(71) Applicant(s):

TONGJI UNIVERSITY [CN/CN]; No. 1239 Siping Road, Yangpu District Shanghai 200092 (CN) *(for all designated states)*

(72) Inventor(s):

CHE, Shunai; No. 1239 Siping Road, Yangpu District Shanghai 200092 (CN)

LIU, Zexi; No. 1239 Siping Road, Yangpu District Shanghai 200092 (CN)

DUAN, Yingying; No. 1239 Siping Road, Yangpu District Shanghai 200092 (CN)

(74) Agent(s):

SHANGHAI DANRONG & ZONGDE INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD.; YU, Danrong Room 1708-1709, 2nd Building No. 335 Guoding Road, Yangpu District Shanghai 200433 (CN)

(54) Title (EN): SYSTEM FOR DETECTING CHIRAL COMPOUND

(54) Title (FR): SYSTÈME DE DÉTECTION DE COMPOSÉ CHIRAL

(54) Title (ZH): 一种手性化合物的检测系统

(57) Abstract:

(EN): The present invention relates to a system for detecting a chiral compound based on a material having a chiral property, the system comprising: a base material and a spectrometer, wherein the base material is composed of the material having a chiral property, and is used for bearing a sample of the chiral compound to be tested; and a light source and detection light of the spectrometer are both unpolarized light. The present invention further relates to a system for detecting a chiral compound also based on a material having a chiral property, the system comprising: a first base material used as a base material in the case of qualitative and quantitative measurements; a second base material used as a base material in the case of percentage content detection; and a spectrometer for detecting the first base material on which a sample to be tested is loaded to obtain a first detection spectrogram for qualitative and quantitative measurements and for detecting the second base material on which the sample to be tested is loaded to obtain a second detection spectrogram for detecting the percentage content of an enantiomer, wherein the second base material is composed of a material having a chiral property.

(FR): La présente invention concerne un système de détection d'un composé chiral, basé sur un matériau possédant une propriété chirale, ce système comprenant : un matériau de base et un spectromètre, le matériau de base étant composé du matériau possédant une propriété chirale, et étant utilisé pour porter un échantillon du composé chiral à tester ; et une source de lumière et une lumière de détection du spectromètre qui sont toutes deux des lumières non polarisées. La présente invention concerne en outre un système de détection d'un composé chiral, également basé sur un matériau possédant une propriété chirale, ce système comprenant : un premier matériau de base utilisé comme matériau de base dans le cas de mesures qualitatives et quantitatives ; un second matériau de base utilisé comme matériau de base dans le cas d'une détection de teneur en pourcentage ; et un spectromètre destiné à détecter un premier matériau de base, sur lequel un échantillon à tester est chargé, afin d'obtenir un premier spectrogramme de détection pour des mesures qualitatives et quantitatives, et destiné à détecter le second matériau de base sur lequel l'échantillon à tester est

chargé afin d'obtenir un second spectrogramme de détection pour détecter la teneur en pourcentage d'un énantiomère, le second matériau de base étant composé d'un matériau possédant une propriété chirale.

(ZH): 涉及一种基于具有手性特质的材料的手性化合物检测系统,包括:基底材料;以及光谱仪,其中,基底材料由具有手性特质的材料构成,用于载置手性化合物的待测样品;光谱仪的光源和检测光均为非偏振光。还涉及一种同样基于具有手性特质的材料的手性化合物检测系统,包括:第一基底材料,用于进行定性定量时作为基底材料;第二基底材料,用于进行含量比例检测时作为基底材料;以及光谱仪,用于对载置了待测样品的第一基底材料进行检测从而得到用于进行定性定量的第一检测谱图,以及对载置了待测样品的第二基底材料进行检测从而得到用于进行对映体含量比例检测的第二检测谱图,其中,第二基底材料由具有手性特质的材料构成。

International search report:

Received at International Bureau: 12 September 2019 (12.09.2019) [CN]

International Report on Patentability (IPRP) Chapter II of the PCT:

Not available

(81) Designated States:

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

European Patent Office (EPO) : AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR

African Intellectual Property Organization (OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) : BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM

Declarations:

Declaration made as to the identity of the inventor (PCT Rules 4.17(i) and 51bis.1(a)(i))